Семинар по возможностям оборудования National Instruments

Дата события: 15 ноября 2013 г., 9:00

Место проведения: ул. Киренского, 28, корпус № 12 (Б), ауд. 420

15 ноября 2013 года в Сибирском федеральном университете пройдёт семинар «Технологии National Instruments в построении измерительных стендов для тестирования полупроводниковых элементов и СВЧ устройств».

Организаторы семинара:

- Институт инженерной физики и радиоэлектроники СФУ,
- компания «National Instruments».

Напомним, что американская компания National Instruments является лидером в области разработки и производства аппаратно-программных средств автоматизации измерений, диагностики, управления и моделирования в широком спектре приложений.

Специалисты компании расскажут о возможностях платформ PXI/PXI Express и построении испытательных стендов на базе приборов PXIe.

Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация:

- по e-mail: отправьте письмо с указанием наименования института, ФИО участников, телефона и электронного адреса на адрес: mav137 [at] yandex [dot] ru;
- по телефону: +7 (391) 291-22-09.

Контакты:
Андрей Мишуров , +7 902 992-35-99

- Программа семинара (.pdf, 420 КБ)

Пресс-служба СФУ, 11 ноября 2013 г.

© Сибирский федеральный университет. Редакция сайта: +7 (391) 246-98-60, info@sfu-kras.ru.

Адрес страницы: https://news.sfu-kras.ru/node/12952